Микротвердость быстрозатвердевшей фольги исследуемого сплава с ростом времени выдержки при комнатной температуре монотонно увеличивается. Причина увеличения микротвердости быстрозатвердевшей фольги сплава Bi<sub>20</sub>In<sub>28</sub>Sn<sub>52</sub> заключается в улучшении структуры границ зерен и фаз благодаря диффузионным процессам, активно протекающим при комнатной температуре.

Таким образом, фольга сплава Bi<sub>20</sub>In<sub>28</sub>Sn<sub>52</sub>, полученная сверхбыстрым охлаждением из расплава, состоит из ε- и γ-фаз. Дисперсные частицы ε-фазы вкраплены в γ-фазе. Средние длины хорд случайных секущих на сечениях выделений ε- и γ-фаз равны 1,7 и 2,6 мкм, соответственно, а удельные поверхности межфазной границы – 0,86 мкм<sup>-1</sup>. Фаза In<sub>4</sub>Sn (γ-фаза) затвердеванием с образованием текстуры (0001). Стабилизация границ зерен и фаз приводит к росту микротвердости фольги при комнатной температуре.

### Литература

1. Шепелевич В.Г. Быстрозатвердевшие легкоплавкие сплавы /В.Г. Шепелевич. – Минск: БГУ, 2015. – 192 с.

2. Shepelevich V.G. The microstructure and microhardness of rapidly solidified foils of eutectic alloy In -47at. % Sn / V.G. Shepelevich, L.P. Scherbachenko // British Journal of Science. Education and Culture. -2015. - Vol.  $111 - N \ge 1(7) - Pp. 863-869$ .

3. Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. М.: Металлургия, 1976. – 270 с.

4. Русаков А.А. Рентгенография металлов / А.А. Русаков. – М.: Металлургия, 1977. – 329 с.

5. Вассерман Г. Текстуры металлических материалов / Г. Вассерманн, И. Гревен. М.: Металлургия, 1969. – 655 с.

#### УДК 535.37

# ВХОЖДЕНИЕ ИОНОВ ТУЛИЯ В КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ И СТЕКЛЯННУЮ ФАЗЫ В ОКСИФТОРИДНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКЕ Ясюкевич А.С.<sup>1</sup>, Кулешов Н.В.<sup>1</sup>, Рачковская Г.Е.<sup>2</sup>, Захаревич Г.Б.<sup>2</sup>, Трусова Е.Е.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>НИЦ Оптических материалов и технологий БНТУ Минск, Республика Беларусь <sup>2</sup>Белорусский государственный технологический институт Минск, Республика Беларусь

Оксифторидные стекла, активированные ионами редкоземельных элементов (РЗЭ) представляют значительный интерес как прекурсоры для получения нанокерамических материалов, которые сочетают в себе низкую энергию фононов фторидов (CaF<sub>2</sub>, SrF<sub>2</sub>, PbF<sub>2</sub>, и др.) с химической и механической стабильностью оксидных матриц. В таких материалах редкоземельные ионы частично входят как в стеклянную, так и в керамическую фазы и есть возможность в некоторой степени формировать спектроскопические характеристики наностеклокерамики.

Для получения лазерной генерации в области спектра ≈1800-1900 нм привлекательными являются материалы, активированные ионами тулия. В данной работе мы изучали оксифторидные стекла состава 30 SiO<sub>2</sub>+10 GeO<sub>2</sub>+20 PbO+30 РbF<sub>2</sub>+10 CdF<sub>2</sub>+х Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (x = 0,1; 0,5; 1,0; 2,0) и стеклокерамики, полученные на основе этих стекол при вторичной термообработке при температуре 400 °C. Гидростатическим методом были определены плотности стекол и по их молярному составу были рассчитаны концентрации ионов тулия в исходных стеклах. В работе [1], где исследовались стекломатериалы близкого состава, было показано, что в результате вторичной термообработки при температуре 400-420 °С из исходного стекла образуется стеклокерамика с кристаллической фазой β-PbF<sub>2</sub>.

При изучении оксифторидных стекол основное внимание нами уделялось разработке спек-

троскопического метода определения относительного содержания ионов тулия в стеклянной и кристаллической фазах в оксифторидной стеклокерамике. Наш метод исследования основан на сравнении спектров поглощения стекол и стеклокерамик, полученных в результате термообработки. Спектры поглощения образцов в виде пластинок толщиной ≈1 мм регистрировались на спектрофотометре Cary 5 000 при комнатной температуре. Распределение кристаллической фазы в наших материалах после термообработки было неоднородным, что приводило к появлению непрозрачных областей в объеме образцов. В работе [2] были представлены спектры сечений поглощения Tm:PbF2. Спектры сечений поглощения исходных стекол и коэффициенты поглощения полученных стеклокерамик были определены нами. Спектр коэффициента поглощения стеклокерамики  $k_{abs}(\lambda)$  может быть представлен в виде

$$k_{abs}(\lambda) = \sigma_{abs}^{gl}(\lambda) N_{Tm} x_1 + \sigma_{abs}^{cr}(\lambda) N_{Tm} x_2, \quad (1)$$

где  $\sigma_{abs}^{gl}(\lambda)$ ,  $\sigma_{abs}^{cr}(\lambda)$  – сечения поглощения ионов тулия в стеклянной и кристаллической фазах, соответственно,  $N_{Tm}$  концентрация тулия в исходном образце стекла,  $x_1$  и  $x_2$  – параметры, которые характеризуют относительное содержание ионов тулия в стеклянной и кристаллической фазах в прозрачной области образца. Тогда часть ионов туллия  $x_3$ , которая находится в непрозрачной части образца может быть определена как  $x_3 = 1 - x_1 - x_2$ . Относительное содержание ионов тулия є в кристаллической фазе в прозрачной области стекломатериала  $\varepsilon = x_2/(x_1 + x_2)$ . Для исследования спектров поглощения оказалась удобной линия в области 1650 нм соответствующая переходу  ${}^{3}H_6 \rightarrow {}^{3}F_4$ .

Параметры  $x_1$  и  $x_2$  определялись в процессе подгонки расчетного спектра по (1) к экспериментально определенному спектру коэффициента поглощения стекла после вторичной термообработки. Режим вторичной термообработки будет указан в следующем виде: Х/Ү, где Х – температура в градусах Цельсия, Ү – длительность термообработки в часах. Для образцов стекла с содержанием Тт<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 0,5 мол %, как и для стекла с Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 0.1 мол % не наблюдалось изменений в спектрах поглощения при вторичной термообработке при следующих режимах: 400/3; 400/6 и 400/9. На рисунках 1 и 2 представлены примеры результатов подгонки спектров поглощения по формуле (1) для образцов стекла содержанием Тт<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 2 мол % и 1 мол %, соответственно.



Рисунок 1 – Спектры поглощения образцов стеклокерамики с исходным содержанием Тm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – 2 мол %. Вторичная термообработка: *a* – 400/3, *b* – 400/6



Рисунок 2 – Спектры поглощения образцов стеклокерамики с исходным содержанием Тт<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – 1 мол %. Вторичная термообработка: *a* – 400/3; *b* – 400/6

На рисунке 3 представлены результаты определения зависимости параметров  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  и є от времени вторичной термообработки при 400 С°.



Рисунок 3 – Зависимости параметров  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ и є от длительности вторичной термообработки:  $a - \text{Tm}_2\text{O}_3 - 2 \text{ мол }$ %,  $b - \text{Tm}_2\text{O}_3 - 1 \text{ мол }$ %

# Как видно из представленных результатов, при увеличении времени термической обработки стекла, возрастает часть ионов тулия в кристаллической фазе, при этом возрастает и часть ионов тулия, которая сосредоточена в рассеивающих (непрозрачных) областях стекломатериала. Таким образом, нами предложен спектроскопический метод определения относительного содержания ионов тулия в стеклянной и кристаллической фазах в оксифторидных стеклокерамиках.

#### Литература

1. Вилейшикова Е.В. Up-конверсионная люминесценция оксифторидной стеклокерамики с нанокристаллами PbF<sub>2</sub>:(Yb<sup>3+</sup>, Eu<sup>3+</sup>, RE<sup>3+</sup>) (RE = Tm, Но или Er) / Е.В. Вилейшикова, П.А. Лойко, Г.Е. Рачковская и др. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2016. – T 83, № 5. – С. 677–685.

2. Yin J.G. Transition Intensities and Excited State Relaxation Dynamics of  $Tm^{3+}$  in  $Tm:PbF_2$  Crystal / J.G. Yin, Y. Hang, X.H. He, et al // Laser Physics. – 2012. – Vol. 22, No. 3. – Pp. 609–613.

## УДК 535.3

## РАСЧЕТ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТЕЙ ОСЛАБЛЕНИЯ, РАССЕЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОДЯННЫХ КАПЕЛЬ Бобученко Д.С.

Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

Известно, что облака и туманы в нижних слоях состоят из мельчайших капель жидкой воды, а в верхних слоях из кристаллов водяного льда. Для дистанционного зондирования атмосферы и исследования климата и других приложений требуются точные знания ослабления, рассеяние и поглощение совокупностью сферических капель.

Факторы эффективности ослабления  $Q_{ext}$ , рассеяния  $Q_{sca}$ , поглощения  $Q_{abs}$ , и обратного рассеяния  $Q_b$  излучения системой частиц, с учетом их распределения по размерам, рассчитывались по формулам:

$$Q_{ext} = \int_0^\infty \frac{\mathcal{C}_{ext}(r)}{\pi r^2} f(r) dr, \qquad (1)$$

$$Q_{sca} = \int_0^\infty \frac{\mathcal{C}_{sca}(r)}{\pi r^2} f(r) dr, \qquad (2)$$

$$Q_{abs} = \int_0^\infty \frac{\mathcal{L}_{abs}(r)}{\pi r^2} f(r) dr, \qquad (3)$$

$$Q_b = \int_0^\infty \frac{C_b(r)}{\pi r^2} f(r) dr \,. \tag{4}$$

В этих формулах r – радиус сферической капли, f(r) – функция распределения капель по размерам,  $C_{\text{ext}}$ ,  $C_{\text{sca}}$ ,  $C_{\text{abs}}$ ,  $C_{\text{b}}$  – сечения ослабления, рассеяния, поглощения и обратного рассеяния одной каплей.

Предполагалось, что спектр капель по размерам описывается нормальным распределением (распределения Гаусса):

$$f(r) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(r-r_0)^2}{2\sigma^2}\right\},$$
 (5)

где  $r_0$  – математическое ожидание (среднее значение),  $\sigma$  – среднеквадратичное отклонение ( $\sigma^2$  –дисперсия).

Сечения ослабления  $C_{ext}$ , рассеяния  $C_{sca}$ , поглощения  $C_{abs}$ , обратного рассеяния  $C_b$  излучения одной капли определялись по суммированием по рядам [1]:

$$C_{est} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)Re(a_n+b_n), \qquad (6)$$

$$C_{sca} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)(|a_n|^2 + |b_n|^2), \qquad (7)$$

$$C_{abs} = C_{est} - C_{sca},\tag{8}$$

$$C_b = \frac{\pi}{k^2} \left| \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)(-1)^n (a_n - b_n) \right|^2, \quad (9)$$

где  $k=2\pi/\lambda$ ,  $\lambda$  – длина волны излучения. В свою очередь коэффициенты  $a_n$ ,  $b_n$  в рядах определялись по формулам:

$$a_{n} = \frac{\left[\frac{D_{n}(mx)}{m} + \frac{n}{x}\right]\Psi_{n}(x) - \Psi_{n-1}(x)}{\left[\frac{D_{n}(mx)}{m} + \frac{n}{x}\right]\xi_{n}(x) - \xi_{n-1}(x)},$$
(10)  
$$b_{n} = \frac{\left[mD_{n}(mx) + \frac{n}{x}\right]\Psi_{n}(x) - \Psi_{n-1}(x)}{\left[1 - \frac{1}{x}\right]\Psi_{n}(x) - \frac{1}{x}}.$$
(11)

$$b_n = \frac{m}{\left[mD_n(mx) + \frac{n}{x}\right]\xi_n(x) - \xi_{n-1}(x)}.$$
 (11)  
В этих выражениях m – относительный ком-

плексный показатель преломления (m=m<sub>r</sub>+im<sub>im</sub>), x = k r - 6езразмерная величина называемая параметром дифракции, функции  $\Psi_n(x), \xi_n(x) -$ Риккати-Бесселя,  $D_n(y) = \frac{d}{dy} ln \Psi_n$ . Для получения точных результатов, расчет  $D_n$  проводился по обратной рекурсии с удвоенной точностью:

$$D_{n-1}(y) = \frac{n}{y} - \frac{1}{D_n(y) + \frac{n}{y}},$$
 (12)

$$D_{max} = 0.0 + i0.0 \ . \tag{13}$$